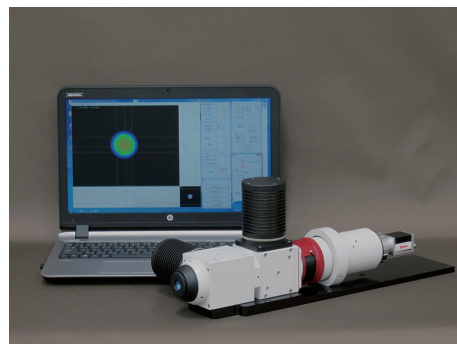


高出力レーザ用 FFP 計測装置

専用光学系+画像処理・解析方式による~10Wクラス高出力レーザ用高機能型FFP（ファーフールドパターン）計測用システム

本装置は、~10W クラス高出力レーザの放射角度分布計測に対応した FFP 計測装置です。光学系は、当社製高出力レーザ用 FFP 計測光学系 M-Scope type HF を使用します。高出力レーザサンプルより出射された光束は、初段の f-θ レンズ光学系を透過後に、偏光補償型中間減衰ユニットにより減光、さらに後段のフィルタ挿入ポートへの減光フィルタ挿入により減光を行い、適正な光量に減光された FFP 像を結像レンズにて 2 次元画像検出器に結像する方式を採用しています。



【特長】

- 高出力レーザ用 FFP 計測光学系 M-Scope type HF を使用。
 - 専用ワイドエリア型 f-θ レンズ光学系+画像処理解析方式。測定も迅速で調整も容易。
 - 測定対象光束径約 3mmφ。広い発光面積のサンプルをカバーするワイドエリア設計。
 - ワーキングディスタンス約 4mm±0.4mm の長作動距離設計。
- 光検出器は 1 インチ高精度 CMOS 検出器 ISA061 を使用（専用）
- 高機能光ビーム解析システム「光ビーム解析モジュール AP013」
 - データ解析装置・光ビーム解析ソフトウェア・検出器ドライバ・補正データ等オールインワンパッケージで、導入後直ちに使用可能。
 - 光ビームプロファイル計測用高機能画像処理ソフトウェア「光ビーム解析ソフトウェア Optometrics BA Standard」をプリインストール。汎用ビームプロファイル解析機能に加え、EF 解析・D86 解析・4σ 解析等の発光パワー分布測定機能を強化。

【システム主要構成】

- FFP 計測光学系
 - 850nm~940nm 用：M-Scope type HF/NIR
 - * その他の計測波長に関しては別途ご相談ください。
- 検出器（専用）
 - 400~1100nm 用：1" 高精度 CMOS 検出器 ISA061
- 光ビーム解析モジュール AP013
 - データ処理装置本体、検出器ドライバ、光ビーム計測解析ソフトウェア Optometrics BA Standard、補正用データ
- 付属品
 - 付属ケーブル類、マニュアル関連等

【検出器セクション（M-Scope type HF 専用）】

検出器	1" 高精度 CMOS 検出器 ISA061
感度波長域	400~1100nm
画素数	2048×2048 画素
ピクセルピッチ	5.5μm 角
角度範囲と分解能	計測角度範囲 約 ±43°/N.A. 0.68 画素分解能 約 0.05°

* 計測角度画素分解能：計測角度範囲と検出器のセンサピッチから計算される検出器 1 ピクセル相当の計測角度です。

【オプション】

- ND フィルタ
 - 近赤外用（650~1100nm） NDF NIR35-5（5 種類セット）
 - ・専用φ35mmタイプ、近赤外用 ND フィルタ
- 光学系用架台
 - ・手動ステージ付光ファイバ測定用光学系架台
 - ・縦型光学系設置架台

【大発光面積対応モデル】

ハイパワーレーザ用 FFP 計測光学系（大発光面積サンプル用）を使用したシステム構成も可能です。

- FFP 計測光学系
 - 850nm~940nm 用：M-Scope type HF+/NIR
 - * その他の計測波長に関しては別途ご相談ください。
- 検出器（推奨）
 - 400~1100nm 用：2/3" 高精度デジタル CCD 検出器 ISA011-01
- 光ビーム解析モジュール AP013
 - データ処理装置本体、検出器ドライバ、光ビーム計測解析ソフトウェア Optometrics BA Standard、補正用データ
- 付属品
 - 付属ケーブル類、マニュアル関連等

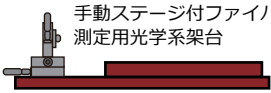
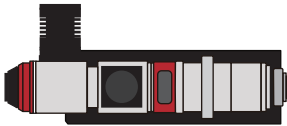
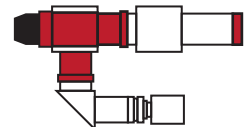
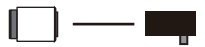
【検出器セクション（M-Scope type HF+ 専用）】

検出器	2/3" 高精度デジタル検出器 ISA011-01
感度波長域	400~1100nm
画素数	1392×1040 画素
ピクセルピッチ	6.45μm 角
角度範囲と分解能	計測角度範囲 約 ±12°/N.A.0.2 画素分解能 約 0.026°

* 計測角度画素分解能：計測角度範囲と検出器のセンサピッチから計算される検出器 1 ピクセル相当の計測角度です。



【高出力レーザ用 FFP 計測装置 コンポーネントセレクション】

○位置決めステージ・架台  サンプルステージ 光学系ステージ  手動ステージ付ファイバ 測定用光学系架台 * 各種電動・手動ステージとの 組み合わせが可能	○FFP 計測光学系&検出器セレクション  高出力レーザ用 FFP 計測光学系 M-Scope type HF  ハイパワーレーザ用 FFP 計測光学系 M-Scope type HF+ ●400~1100nm 用  1インチ高精度CMOS検出器 ISA061 ●400~1100nm 用  2/3インチ高精度デジタルCCD 検出器 ISA011-01	○光ビーム解析モジュール AP013  データ解析装置 ・本体 ・I/F ボード関連 ・付属品  ●光ビーム計測解析ソフトウェア Optometrics BA Standard ●画像検出器ドライバソフトウェア ●計測用補正データ ○光学系アクセサリ  近赤外用 35φ減光フィルタセット NDF NIR35-5
---	---	--